

Thema

Bewertung der Eigenschaften von Nahfeldsonden mit einer neuartigen Methode basierend auf Huygens-Box Daten mittels CST

Motivation und Zielstellung

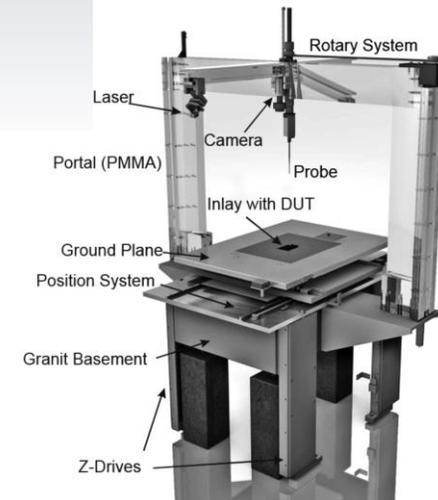
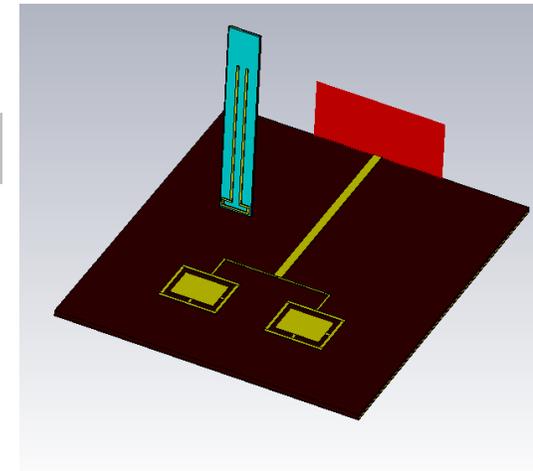
- Nahfeldscanner nutzen Nahfeldsonden zur Feldmessung
- Die Eigenschaften der Nahfeldsonden müssen bekannt sein, um aus den Messdaten die Felddaten zu bestimmen
- *Simulierte Messungen* helfen bei der Entwicklung von Sonden
- Hoher Rechenaufwand für detaillierte Modelle
- **Idee: Testobjekt wird durch seine Huygens-Box Daten (tangentielle Felddaten) ersetzt und modelliert**

Aufgaben (mögliche)

- Einarbeitung in Thematik und ggf. CST
- Aufbau von Sondenmodellen und Testobjekten
- Durchführen verschiedener Simulationskombinationen
- Vergleich und Bewertung der neuartigen Methode
- Dokumentation und Vortrag

Ansprechpartner

Dominik Schröder
Fraunhofer ENAS
Abteilung: Advanced System Engineering
Mail: dominik.schroeder@enas-pb.fraunhofer.de



Dr.-Ing. Denis Sievers
Universität Paderborn
Fachgebiet TET
05251 / 60-3010
sievers@tet.upb.de